非破壊検査機器

膜厚計

磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。
アルマイト などの比較的に薄い被膜厚を測定することができます。

【LZ-373】株式会社ケツト科学研究所

測定方式	電磁誘導式/渦電流式兼用
測定対象物	磁性金属上の非磁性被膜 非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	電磁誘導式：0～2500μmまたは99.0mils 渦電流式：0～1200μmまたは47.0mils
測定精度	50μm 未満：±1μm、50μm 以上1000μm 未満：±2% 1000μm 以上：±3%
分解能	100μm未満：0.1μm、100μm 以上：1μm
データメモリ数	約39,000点
プローブ	一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J)
表示方法	デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
外部出力	パソコン(USBまたはRS-232C)に出力可能
電源	電池1.5V(単3アルカリ乾電池)×4本
電池寿命	100時間(バックライト非点灯時、連続使用)
寸法・質量	75(W)×145(D)×31(H)㎜・0.34kg
付属品	標準板×6枚、標準板ケース、単3アルカリ乾電池×4本、プローブアダプター、鉄素地、アルミ素地

■電磁式と渦電流式の両測定機能を備えた膜厚計
■データメモリー39000点、統計計算機能
■小型・軽量のコンパクトボディ
■測定範囲 電磁式:0～2500μm、渦電流式:0～1200μm
■アプリケーションメモリー（検量線メモリー）機能

SWT-9000はFN-325プローブを装備していますので、鉄・非鉄の素地を自動判別可能な膜厚計です。
SWT-9200はFe-20プローブを装備していますので、鉄素地を0～20㎜測定が可能な膜厚計です。

【SWT-9000／9200】株式会社サンコウ電子研究所

SWT-9000

SWT-9200

型式	SWT-9000	SWT-9200
プローブ型式	FN-325	Fe-20
測定方式	電磁・渦電流両用式	電磁誘導式
測定範囲	鉄素地：0～3.00㎜ 非鉄素地：0～2.50㎜	0～20㎜
表示分解能	1μm：0～999μm(鉄・非鉄共通)切替により、 0.1μm：0～400μm(鉄・非鉄共通) 0.5μm：400～500μm(鉄・非鉄共通) 0.01㎜：1.00～3.00㎜(鉄素地) 0.01㎜：1.00～2.50㎜(非鉄素地)	1μm：0～999μm 0.01㎜：1～5㎜ 0.1㎜：5～20㎜
測定精度（平滑面に対して垂直に測定）	0～100μm：±1μm（鉄・非鉄共通） または指示値の ±2% 以内 01μm～3.00mm：±2% 以内（鉄素地） 01μm～2.50mm：±2% 以内（非鉄素地）	0～3㎜：±(5μm＋指示値の3%) 3.01㎜以上：指示値の±3% 以内
検量線メモリ	鉄・非鉄用で各 1 本	10 本
測定値メモリ	—	20,000 点
データ転送	—	USB
統計機能	—	本体内蔵
電源	単 3 乾電池 ×2本	単 3 乾電池 ×2本、 専用 AC アダプタ
外形寸法・重量	72(W)×156(D)×32(H)㎜・約200g	
付属品	単 3 乾電池 ×2本	単 3 乾電池×2本、AC アダプター